### Hardware Trojan Detection

Maximilian Heim

University Albstadt-Sigmaringen

June 19, 2022





- Introduction
  - Hardware Trojans
- 2 Destruktive Detektion
- Nicht-Destruktive Detektion
- 4 Fazit

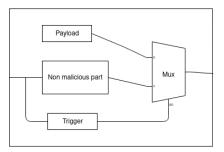




### Was sind Hardware Trojaner?

- Bösartige Modifikation eines Integrierten Schaltkreises
- 2 Trigger (Time bombs, cominational...)
- 3 Payload (Denial of service, extraction of information, keys)

Figure: Theoretischer Aufbau eines HW Trojaners







# Destruktives Reverse Engineering

- Entfernen der Oberfläche
- Visuelle Inspektion
- Vergleich mit Golden Sample
- Vorteile:
  - **1**00 % Erkennungsrate
- Nachteile:
  - Testet nur einen Chip
  - ② Destruktiv
  - Zeitaufwändig
  - Unclonable functions





### **Funktionstests**

- Beobachten der Ausgabe bei bestimmten Eingängen
- Vergleich mit Golden Sample
- Problem: Großer Trojan Space
- Vorteile:
  - Sehr einfacher Testaufbau
  - 4 Hohe Erkennungsrate
  - 4 Hunderte IC's können parallel getestet werden
- Nachteile:
  - Je nach Komplexität des IC's sehr zeitaufwändig/unmöglich





### Funktionstests: Statistischer Ansatz

- R.S. Chakraborty et al, "MERO: A Statistical Approach for Hardware Trojan Detection"
- https://link.springer.com/content/pdf/10.1007/ 978-3-642-04138-9\_28.pdf
- Netzliste → Testvektoren
- Vektoren werden N mal getestet
- Reduktion der Testzeit um 85 %





#### Seitenkanaltest

- Beobachten der Leistungsaufnahme/Pfadverzögerung
- Vergleich mit Golden Sample
- Vorteile:
  - Erkennung ohne Aktivierung
  - Sehr einfacher Testaufbau
  - Mohe Erkennungsrate
  - 4 Hunderte IC's können parallel getestet werden
- Nachteile:
  - Produktionsvariationen
  - 2 Bei sehr kleinen Trojanern kann die Leakage sehr klein werden





# Seitenkanaltest: Fingerprinting

- D. Agrawal et al, "Trojan Detection using IC Fingerprinting"
- https://ieeexplore.ieee.org/stamp/stamp.jsp?tp= &arnumber=4223234
  - Select random ICs
  - 2 Run IO tests, record traces
  - Build fingerprint
  - Oestructively test for HW Trojan
  - Match Sidechannel fingerprint of ICs to test with those of the reference





#### **Fazit**

- Destruktive Detektion ungeeignet f
  ür Testen von ICs die verwendet werden sollen
- Gegenüberstellung von Funktionstests und Seitenkanaltests:

|      | Funktionstests   | Seitenkanaltests   |
|------|--|--|
| Pros | <ol> <li>Effektiv für kleine Trojaner</li> <li>Produktionstoleranz unabhängig</li> </ol> | 1.Effektiv für große Tro-<br>janer<br>2. einfache Testerzeugung  |
| Cons | 1. Testerzeugung komplex   | <ol> <li>Anfällig für Produktionstoleranzen</li> <li>Detektion von kleinen</li> <li>Trojanern schwierig</li> </ol> |

 Wie man sieht: Die Verfahren ergänzen sich → Kombination beider Verfahren



Fazit



#### Quellen

- https:/d/dl.acm.org/doi/pdf/10.1145/2906147
- https://ieeexplore.ieee.org/stamp/stamp.jsp?tp= &arnumber=5340158
- https://www.fkie.fraunhofer.de/content/dam/fkie/ de/documents/HWT-Bericht/HWT-Bericht\_Cover.pdf

